

別表（第7条関係）

## 各業務及び共用設備における利用料一覧

業務	共用設備 (メーカー名、型番)	利用料(円) (消費税を除く。)			試験単位等 (標準測定時間)	
		学術研究機関	中小企業	大企業		
技術相談		無料	1件あたり最初の2時間まで10,000円。相談時間を延長する場合は、延長2時間につき15,000円(技術相談は、原則として1日につき1回2時間までとする。)。なお、上記以外に作業費が発生する場合は、実費を別途請求する。			
技術代行	300kV透過電子顕微鏡 (300kV-TEM) (JEOL JEM-3100FEF)	37,500	75,000	112,500	1検体 (4時間以内)	
	200kV透過電子顕微鏡 (200kV-TEM) (※1) (JEOL JEM-2200FS)	14,400	28,800	43,200	1検体 (4時間以内)	
	走査透過電子顕微鏡 (STEM) (HITACHI HD-2700)	46,800	93,500	140,300	1検体 (4時間以内)	
	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	13,700	27,400	41,100	1検体 (4時間以内)	
	低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	9,700	19,400	29,100	1検体 (4時間以内)	
	微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	67,500	135,000	202,500	1検体 (8時間以内)	
	走査プローブ顕微鏡 (SPM) (HITACHI SPA400)	2,700	5,300	8,000	1検体 (2時間以内)	
	二重収束型質量分析計 (Sector) (※2、※3) (JEOL JMS-700 MStation)	2,000	4,000	6,000	1検体 (1時間以内)	
	LC/TOFMS (※4) (JEOL JMS-T100LC AccuTOF)	2,000	4,000	6,000	1検体 (1時間以内)	
	LC/TOFMS高分解能飛行時間型質量分析装置 (※4、※5) (JEOL AccuTOF LC-plus 4G, DART/ESI/CSI/APCI)	2,000	4,000	6,000	1検体 (1時間以内)	
	MALDI-TOFMS (Bruker autoflex II)	2,000	4,000	6,000	1検体 (1時間以内)	
	MALDI-SpiralTOFMS (JEOL JMS-S3000)	2,000	4,000	6,000	1検体 (1時間以内)	
	X線構造解析装置 (Rigaku SmartLab9kW/IP/HY/N)	5,000	10,000	15,000	1検体 (4時間以内)	
	微小結晶X線構造解析装置 (Rigaku VariMax RAPID RA-Micro7)	27,300	54,500	81,800	1検体 (20時間以内)	
	高輝度X線発生装置 (Rigaku NanoViewer)	21,000	42,000	63,000	1検体 (8時間以内)	
	600MHz超伝導NMR (※6) (JEOL JNM-ECA600)	1,300	2,600	3,900	1検体 (0.5時間以内)	
			(1H以外の核種 (13C等) の場合は、1検体当たり6倍の利用料とする。)			
	500MHz超伝導NMR (※6、※7) (JEOL JNM-ECX500)	1,000	2,000	2,900	1検体 (0.5時間以内)	
			(1H以外の核種 (13C等) の場合は、1検体当たり6倍の利用料とする。)			
	400MHz固体超伝導NMR (※6、※7、※8) (JEOL JNM-ECX400P)	1,000	2,000	2,900	1検体 (0.5時間以内)	
			(1H以外の核種 (13C等) の場合は、1検体当たり6倍の利用料とする。)			
	電子スピン共鳴装置 (ESR) (JEOL JES-FA100N)	2,400	4,800	7,200	1検体 (4時間以内)	
	電子線マイクロアナライザ (EPMA) (SHIMADZU EPMA1610)	20,000	60,000	60,000	1検体 (4時間以内)	
	二次イオン質量分析装置 (SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	8,900	17,700	26,600	1検体 (8時間以内)	
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (ULVAC-PHI PHI5000VersaProbe II)	9,600	19,200	28,800	1検体 (8時間以内)	
	顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	3,800	7,500	11,300	1検体 (4時間以内)	
	円二色性分散計 (CD) (JASCO J-725)	3,400	6,800	10,200	1検体 (3時間以内)	
	ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	6,300	12,600	18,900	1検体 (6時間以内)	
	分光エリブソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISEL ER AGMS-NSD)	5,600	11,100	16,700	1検体 (2時間以内)	
	フェムト秒パルスレーザー (※9) (チタンサファイア) (Coherent Mira 900)	13,800	27,600	41,400	1検体 (8時間以内)	
	サブナノ秒パルスレーザー (窒素) (※9) (USHO KEC-160)					
	ストリークスコープ (※9) (HAMAMATSU C4780)					
	全自動元素分析装置 (PerkinElmer 2400 II CHNS/O)	700	1,400	2,100	1検体 (0.5時間以内)	

	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/STA 7200)	4,500	9,000	13,500	1 検体 (4時間以内)
	熱/電気物性評価装置 (物性評価装置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	6,500	12,900	19,300	1 検体 (8時間以内)
	大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	1,300	2,500	3,700	1 検体 (1時間以内)
	分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	2,800	5,500	8,300	1 検体 (2時間以内)
	微細形状測定装置 (Kosaka Laboratory ET200)	1,000	2,000	3,000	1 検体 (1時間以内)
機器利用	超高分解能電界放出型電子顕微鏡 (FE-SEM) (HITACHI SU9000)	3,500	6,900	10,300	1 時間
	低真空分析走査電子顕微鏡 (HITACHI SU6600)	3,300	6,500	9,700	1 時間
	微小デバイス特性評価装置 (nanoEBAC) (HITACHI NE4000)	22,500	45,000	67,500	1 時間
	走査プローブ顕微鏡 (SPM) (HITACHI SPA400)	1,400	2,700	4,000	1 時間
	MALDI-TOFMS (Bruker autoflex II)	1,800	3,600	5,400	1 時間
	500MHz超伝導NMR (※6、※7) (JEOL JNM-EX500)	2,000	3,900	5,800	1 時間
	400MHz固体超伝導NMR (※6、※7、※8) (JEOL JNM-EX400P)	2,000	3,900	5,800	1 時間
	二次イオン質量分析装置 (SIMS) (ULVAC-PHI ADEPT-1010)	3,000	5,900	8,900	1 時間
	多機能走査型X線光電子分光分析装置 (XPS) (ULVAC-PHI PHI5000VersaProbe II)	1,100	2,100	3,100	1 時間
	顕微レーザーラマン分光光度計 (JASCO NRS-4100)	1,300	2,500	3,800	1 時間
	円二色性分散計 (CD) (JASCO J-725)	1,200	2,300	3,400	1 時間
	ダイナミック光散乱光度計 (Otsuka Electronics DLS-6000)	1,100	2,100	3,200	1 時間
	分光エリプソメーター (HORIBA JOBIN YVON UVISSEL ER AGMS-NSD)	1,900	3,700	5,600	1 時間
	示差走査熱量計・示差熱重量同時測定装置 (HITACHI DSC 7000X/STA 7200)	1,200	2,300	3,400	1 時間
	熱/電気物性評価装置 (物性評価装置: PPMS) (Quantum Design PPMS EverCool II)	1,000	2,000	3,000	1 時間
	大気中光電子分光装置 (RIKEN KEIKI AC-3)	1,300	2,500	3,700	1 時間
	分光感度・内部量子効率測定装置 (BUNKOUKEIKI CEP-2000RP)	900	1,800	2,700	1 時間
	微細形状測定装置 (Kosaka Laboratory ET200)	1,000	2,000	3,000	1 時間
協力研究 (※10)		50,000	100,000	150,000	1 期

- ・利用時間に装置の立ち上げ・立ち下げに係る時間を含む。また、利用時間は原則として平日の9時から17時までの間とする。
- ・技術代行において1検体当たりの標準測定時間を超過する場合又は特別な観察若しくは分析に必要な処理を要する場合は、規定の利用料に加え、別途実費相当額を利用料として徴収することがある。
- (※1) EELS、電子回折法及びクライオ電子顕微鏡法による測定はできない。
- (※2) 1検体では、ポジティブモード又はネガティブモードのどちらか1モードでの測定となる。両モードの測定を希望する場合は、2検体となる。
- (※3) GC利用の場合は、再現性確認のために2回にわたって測定を行うことから、1検体当たり2倍の利用料を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として1測定当たり別途3検体分の利用料を徴収する。
- (※4) 本学のカラムを利用する場合は、1検体当たり別途1,000円(消費税を除く)を徴収するとともに、測定に時間を要するため1検体当たり3倍の利用料を徴収する。また、本学で移動相を用意する場合は、1検体当たり別途500円(消費税を除く)を徴収する。これに加え、装置の起動及び条件調整に係る料金として、LC条件提示が有る場合は1測定当たり別途4検体分、LC条件提示が無い場合は1測定当たり別途8検体分の利用料を徴収する。
- (※5) CSI測定の場合は、装置の起動に係る料金として1測定当たり別途1検体分の利用料を徴収する。
- (※6) 溶液試料測定に用いる重水素化溶媒は、利用者が用意する。
- (※7) 1測定当たりの測定時間は、最大3時間とする。
- (※8) 液体サンプルについては機器利用のみ、固体サンプルについては技術代行のみ可能とする。
- (※9) 利用機器の使用数にかかわらず、1検体あたりの利用料とする。
- (※10) 第1期(4月～6月)、第2期(7月～9月)、第3期(10月～12月)の3期を対象とし、利用申請を受け付ける。